

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

US
225
⑦

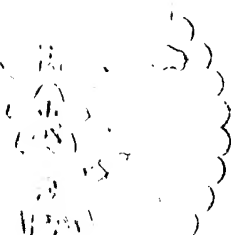
別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日
Date of Application: 2003年 1月30日

出願番号
Application Number: 特願2003-021959
[ST. 10/C]: [JP2003-021959]

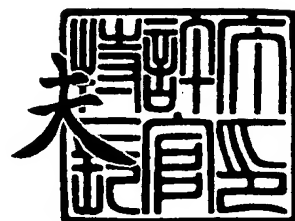
出願人
Applicant(s): NECエレクトロニクス株式会社



2003年12月16日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今井康夫



出証番号 出証特2003-3104137

PATENT
8017-1122

IN THE U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re application of: Noriaki ODA
Appl. No.: NEW NON-PROVISIONAL
Filed: January 22, 2004
Title: SEMICONDUCTOR DEVICE AND METHOD OF FABRICATON SAME

Conf.:
Group:
Examiner:

CLAIM TO PRIORITY

Assistant Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

January 22, 2004

Sir:


Applicant(s) herewith claim(s) the benefit of the priority filing date of the following application(s) for the above-entitled U.S. application under the provisions of 35 U.S.C. § 119 and 37 C.F.R. § 1.55:

| <u>Country</u> | <u>Application No.</u> | <u>Filed</u> |
|----------------|------------------------|------------------|
| JAPAN | 2003-021959 | January 30, 2003 |

Certified copy(ies) of the above-noted application(s) is(are) attached hereto.

Respectfully submitted,

YOUNG & THOMPSON



Benoit Castel, Reg. No. 35,041

745 South 23rd Street
Arlington, VA 22202
Telephone (703) 521-2297

BC/yr

Attachment(s): 1 Certified Copy(ies)

()

【書類名】 特許願

【整理番号】 74112784

【提出日】 平成15年 1月30日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 H01L 21/60

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県川崎市中原区下沼部 1 7 5 3 番地 N E C エレ
クトロニクス株式会社内

【氏名】 小田 典明

【特許出願人】

【識別番号】 302062931

【氏名又は名称】 N E C エレクトロニクス株式会社

【代理人】

【識別番号】 100088328

【弁理士】

【氏名又は名称】 金田 暢之

【電話番号】 03-3585-1882

【選任した代理人】

【識別番号】 100106297

【弁理士】

【氏名又は名称】 伊藤 克博

【選任した代理人】

【識別番号】 100106138

【弁理士】

【氏名又は名称】 石橋 政幸

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 089681

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 0216444

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 半導体装置、および半導体装置の製造方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 半導体基板上にボンディングパッドを有する半導体装置であって、

前記ボンディングパッドの下面にバリアメタルを介して形成された上部Cu層と、

前記上部Cu層と比べてCu面積率が同等以下で、前記上部Cu層より前記半導体基板側に形成された下部Cu層と、
を有することを特徴とする半導体装置。

【請求項 2】 半導体基板上にボンディングパッドを有する半導体装置であって、

前記ボンディングパッドの下面にバリアメタルを介して形成され、回路配線が形成される層よりもCu面積率が大きな上部Cu層と、

前記上部Cu層と電氣的に絶縁され、前記上部Cu層よりも前記半導体基板側に形成された下部Cu層と、
を有することを特徴とする半導体装置。

【請求項 3】 請求項 1 または 2 記載の半導体装置であって、
上部Cu層はCu面積率が70%以上95%以下であることを特徴とする半導体装置。

【請求項 4】 請求項 1 乃至 3 のいずれか 1 項記載の半導体装置であって、
ボンディングパッドおよび上部Cu層は平面寸法が略同一であることを特徴とする半導体装置。

【請求項 5】 請求項 1 乃至 4 のいずれか 1 項記載の半導体装置であって、
上部Cu層が複数からなることを特徴とする半導体装置。

【請求項 6】 請求項 5 に記載の半導体装置であって、
複数の上部Cu層における各Cu層のCu面積率が同一であることを特徴とする半導体装置。

【請求項 7】 請求項 5 または 6 記載の半導体装置であって、

複数の上部 Cu 層の層間には層間絶縁膜が設けられ、
前記各 Cu 層は、前記層間絶縁膜中に Cu が埋設されたビアプラグを介して接続されていることを特徴とする半導体装置。

【請求項 8】 請求項 7 記載の半導体装置であって、
複数の上部 Cu 層として、半導体基板側からボンディングパッド側に第 1 Cu 層、第 2 Cu 層、…、および第 n Cu 層（n は 2 以上の自然数）が順に設けられている場合、

ビアプラグ、および前記第 n Cu 層の Cu 層パターンが第 1 の材料よりなる絶縁膜に埋設されていることを特徴とする半導体装置。

【請求項 9】 請求項 1 乃至 8 のいずれか 1 項記載の半導体装置であって、
下部 Cu 層は Cu 面積率が 1 5 % 以上 9 5 % 以下であることを特徴とする半導体装置。

【請求項 1 0】 請求項 1 乃至 9 のいずれか 1 項記載の半導体装置であって、
下部 Cu 層が複数からなることを特徴とする半導体装置。

【請求項 1 1】 請求項 1 0 記載の半導体装置であって、
複数の下部 Cu 層における各 Cu 層の Cu 面積率が同一であることを特徴とする半導体装置。

【請求項 1 2】 請求項 1 0 または 1 1 記載の半導体装置であって、
複数の下部 Cu 層の各 Cu 層間に第 1 の材料よりなる絶縁膜が介在することを特徴とする半導体装置。

【請求項 1 3】 請求項 1 0 乃至 1 2 のいずれか 1 項記載の半導体装置であって、
複数の下部 Cu 層の各 Cu 層において同一層に形成された Cu 層パターン間に、第 1 の材料に比べて比誘電率が低い材料を有する第 2 の材料よりなる絶縁膜が介在することを特徴とする半導体装置。

【請求項 1 4】 請求項 1 3 に記載の半導体装置であって、
第 2 の材料が第 1 の材料よりも軟質であることを特徴とする半導体装置。

【請求項 1 5】 請求項 1 3 または 1 4 に記載の半導体装置であって、

第2の材料よりなる絶縁膜は、SiOC膜、SiC膜、SiOF膜、ポーラスSiO₂膜、ポーラスSiOC膜、および梯子型水素化シロキサン構造を有するラダーオキサイド膜のうちいずれか一つを含むことを特徴とする半導体装置。

【請求項16】 請求項10、11、および13乃至15記載の半導体装置であって、

複数の下部Cu層の各Cu層間に、第1の材料に比べて比誘電率が低い材料を有する第3の材料よりなる絶縁膜が介在することを特徴とする半導体装置。

【請求項17】 請求項16に記載の半導体装置であって、

第3の材料が第1の材料よりも軟質であることを特徴とする半導体装置。

【請求項18】 請求項16または17に記載の半導体装置であって、

第3の材料よりなる絶縁膜は、SiOC膜、SiC膜、SiOF膜、ポーラスSiO₂膜、ポーラスSiOC膜、および梯子型水素化シロキサン構造を有するラダーオキサイド膜のうちいずれか一つを含むことを特徴とする半導体装置。

【請求項19】 請求項1乃至18のいずれか1項記載の半導体装置であって、

バリアメタルがTiNおよびTa₂Nのうちいずれか一方を含むことを特徴とする半導体装置。

【請求項20】 請求項1乃至19のいずれか1項記載の半導体装置であって、

前記半導体装置に内部回路を備え、

前記内部回路およびボンディングパッドと電気的に接続された補助Cu配線を有することを特徴とする半導体装置。

【請求項21】 請求項1乃至20のいずれか1項記載の半導体装置の製造方法であって、

上部Cu層および下部Cu層をダマシン法により形成することを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項22】 請求項8乃至10、19、および20のいずれか1項記載の半導体装置の製造方法であって、

第nCu層および該第nCu層に接触するビアプラグをデュアルダマシン法に

より形成することを特徴とする半導体装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0 0 0 1】

【発明の属する技術分野】

本発明は、ワイヤーボンディングのためのボンディングパッドを有する半導体装置およびその製造方法に関する。

【0 0 0 2】

【従来の技術】

従来、銅（C u）配線を用いた半導体装置において、C u 配線上にボンディングパッドを形成する際、ボンディング部分をC u 配線上からずれた位置に設けるようにしているものがある（例えば、特許文献1 参照）。

【0 0 0 3】

図5 は従来技術による半導体装置の一構成例を示す断面構造図である。

【0 0 0 4】

図5 では、半導体基板1 0 上に形成されたC u 配線7 0 0 上に複数のC u パッドが設けられ、C u 最上層パッド7 1 0 上にバリアメタル7 2 0 を介して最上層A l 配線7 3 0 が形成されている。そして、上述のように、最上層A l 配線7 3 0 のボンディング部分7 3 5 がC u 配線7 0 0 上からずれた位置にある。そのため、ボンディング時のストレスがボンディング部分7 3 5 の下層のパッシベーション絶縁膜7 4 0 および層間絶縁膜7 5 0 にかかり、C u 配線7 0 0 へのストレスの影響が低減され、C u 配線7 0 0 が表面に露出することを防げる。

【0 0 0 5】

【特許文献1】

特開 2 0 0 1 - 1 5 5 1 6 号公報（第4 頁～第5 頁、第2 図）

【0 0 0 6】

【発明が解決しようとする課題】

上述した公報に示される半導体装置は、次のような問題があった。

【0 0 0 7】

C u 配線上からずれた位置にボンディング部分を設けると、その分ボンディン

グパッドの面積が大きくなり、チップサイズの拡大化を招くことになる。

【0 0 0 8】

また、酸化膜よりも比誘電率が小さい低比誘電率膜がボンディング部分の下に存在する場合、プロービングやボンディング時の針の荷重によりボンディングパッドが沈み込み、ボンディングパッド下の層間絶縁膜にクラックが発生したり、ボンディングパッドの膜剥れが生じたりする。

【0 0 0 9】

本発明は上記したような従来の技術が有する問題点を解決するためになされたものであり、プロービングおよびボンディング時のボンディングパッドへの衝撃に対する耐性（以下、「衝撃耐性」と称する）を向上させた半導体装置およびその製造方法を提供することを目的とする。

【0 0 1 0】

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するための本発明の半導体装置は、半導体基板上にボンディングパッドを有する半導体装置であって、

前記ボンディングパッドの下面にバリアメタルを介して形成された上部Cu層と、

前記上部Cu層と比べてCu面積率が同等以下で、前記上部Cu層より前記半導体基板側に形成された下部Cu層と、
を有する構成である。

【0 0 1 1】

また、本発明の半導体装置は、半導体基板上にボンディングパッドを有する半導体装置であって、

前記ボンディングパッドの下面にバリアメタルを介して形成され、回路配線が形成される層よりもCu面積率が大きな上部Cu層と、

前記上部Cu層と電氣的に絶縁され、前記上部Cu層よりも前記半導体基板側に形成された下部Cu層と、
を有する構成である。

【0 0 1 2】

また、上記本発明の半導体装置において、上部Cu層はCu面積率が70%以上95%以下であることとしてもよく、ボンディングパッドおよび上部Cu層は平面寸法が略同一であることとしてもよい。

【0013】

また、上記本発明の半導体装置において、上部Cu層が複数からなることとしてもよく、複数の上部Cu層における各Cu層のCu面積率が同一であることとしてもよい。

【0014】

また、上記本発明の半導体装置において、複数の上部Cu層の層間には層間絶縁膜が設けられ、

前記各Cu層は、前記層間絶縁膜中にCuが埋設されたビアプラグを介して接続されていることとしてもよい。

【0015】

また、上記本発明の半導体装置において、複数の上部Cu層として、半導体基板側からボンディングパッド側に第1Cu層、第2Cu層、…、および第nCu層（nは2以上の自然数）が順に設けられている場合、

ビアプラグ、および前記第nCu層のCu層パターンが第1の材料よりなる絶縁膜に埋設されていることとしてもよい。

【0016】

また、上記本発明の半導体装置において、下部Cu層はCu面積率が15%以上95%以下であることとしてもよく、下部Cu層が複数からなることとしてもよい。

【0017】

また、上記本発明の半導体装置において、複数の下部Cu層における各Cu層のCu面積率が同一であることとしてもよく、複数の下部Cu層の各Cu層間に第1の材料よりなる絶縁膜が介在することとしてもよい。

【0018】

また、上記本発明の半導体装置において、複数の下部Cu層の各Cu層において同一層に形成されたCu層パターン間に、第1の材料に比べて比誘電率が低い

材料を有する第2の材料よりなる絶縁膜が介在することとしてもよく、第2の材料が第1の材料よりも軟質であることとしてもよい。

【0019】

また、上記本発明の半導体装置において、第2の材料よりなる絶縁膜は、SiOC膜、SiC膜、SiOF膜、ポーラスSiO₂膜、ポーラスSiOC膜、および梯子型水素化シロキサン構造を有するラダーオキサイド膜のうちいずれか一つを含むこととしてもよい。

【0020】

また、上記本発明の半導体装置において、複数の下部Cu層の各Cu層間に、第1の材料に比べて比誘電率が低い材料を有する第3の材料よりなる絶縁膜が介在することとしてもよく、第3の材料が第1の材料よりも軟質であることとしてもよい。

【0021】

また、上記本発明の半導体装置において、第3の材料よりなる絶縁膜は、SiOC膜、SiC膜、SiOF膜、ポーラスSiO₂膜、ポーラスSiOC膜、および梯子型水素化シロキサン構造を有するラダーオキサイド膜のうちいずれか一つを含むこととしてもよい。

【0022】

また、上記本発明の半導体装置において、バリアメタルがTiNおよびTa₂Nのうちいずれか一方を含むこととしてもよい。

【0023】

さらに、上記本発明の半導体装置において、前記半導体装置に内部回路を備え、前記内部回路およびボンディングパッドと電氣的に接続された補助Cu配線を有することとしてもよい。

【0024】

一方、上記目的を達成するための本発明の半導体装置の製造方法は、上部Cu層および下部Cu層をダマシン法により形成するものである。

【0025】

また、本発明の半導体装置の製造方法は、第 n Cu 層および該第 n Cu 層に接触するビアプラグをデュアルダマシン法により形成するものである。

【0026】

(作用)

上記のように構成される本発明では、Cu は外部から加えられた力を跳ね返そうとする性質である弾性が酸化膜より大きいため、ボンディングパッド下に、耐衝撃層として、上部 Cu 層、および上部 Cu 層と同等以下の Cu 面積率を有する下部 Cu 層を設けることで、プロービングおよびボンディング時の衝撃に対する耐性が向上する。

【0027】

また、本発明では、Cu は弾性が酸化膜より大きいため、ボンディングパッド下に、回路配線が形成される層よりも Cu 面積率が大きい上部 Cu 層、および下部 Cu 層を設けることで、プロービングおよびボンディング時の衝撃に対する耐性が向上する。

【0028】

また、本発明では、上部 Cu 層の Cu 面積率を 70% 以上 95% 以下にすることで、プロービングおよびボンディング時の衝撃耐性がより向上する。

【0029】

また、本発明では、ボンディングパッドと上部 Cu 層との平面パターン寸法が同一なので、ボンディングパッドと上部 Cu 層との接触面積が十分得られる。

【0030】

また、本発明では、上部 Cu 層を複数にすることで、衝撃が各 Cu 層に分散する。また、本発明では、上部各 Cu 層の Cu 面積率が同一であるため、衝撃がより均等に分散する。

【0031】

また、本発明では、上部各 Cu 層がビアプラグを介して接続されているため、最上層の衝撃が他の層に、より分散しやすくなる。

【0032】

また、本発明では、上部第 n Cu 層およびビアプラグが埋設された、第 1 の材

料よりなる絶縁膜が硬質であるため、ボンディング時に最も大きな衝撃力を受ける上部第 n Cu 層およびビアプラグを絶縁膜が均一に支持する。

【0033】

また、本発明では、下部 Cu 層の Cu 面積率を 15% 以上 95% 以下にすることで、衝撃耐性をさらに向上することができる。そのため、下部 Cu 層を Cu 面積率 15% 以上 95% 以下の回路配線層として利用し、ボンディングパッドの下領域を有効に活用できる。

【0034】

また、本発明では、下部 Cu 層を複数にすることで、下部 Cu 層に伝わる衝撃が各層に分散する。

【0035】

また、本発明では、下部各 Cu 層の Cu 面積率が同一であるため、下部 Cu 層に伝わる衝撃がより均等に分散する。

【0036】

また、本発明では、下部 Cu 層の各 Cu 層間に、第 1 の材料よりなる絶縁膜を用いることで、絶縁膜が下部 Cu 層をより均一に支持する。

【0037】

また、本発明では、上部 Cu 層および下部 Cu 層を設け、ボンディングパッドへの衝撃耐性が向上することにより、第 1 の材料よりも比誘電率の低い材料を有する第 2 の材料よりなる絶縁膜を下部 Cu 層の層間絶縁膜に用いることができ、異なる配線層の間の配線間容量を低減できる。

【0038】

また、本発明では、上部 Cu 層および下部 Cu 層を設け、ボンディングパッドへの衝撃耐性が向上することにより、第 1 の材料よりも軟質な第 2 の材料よりなる絶縁膜を下部 Cu 層の層間絶縁膜に用いることができる。

【0039】

また、本発明では、上部 Cu 層および下部 Cu 層を設け、ボンディングパッドへの衝撃耐性が向上することにより、第 1 の材料よりも比誘電率の低い材料を有する第 3 の材料よりなる絶縁膜を下部 Cu 層に介在する絶縁膜に用いることがで

き、同一層に形成される配線同士の間の容量を低減できる。

【0040】

また、本発明では、上部Cu層および下部Cu層を設け、ボンディングパッドへの衝撃耐性が向上することにより、第1の材料よりも軟質な第3の材料よりなる絶縁膜を下部Cu層に介在する絶縁膜に用いることができる。

【0041】

また、本発明では、バリアメタルとして、TiNおよびTa₂Nのうちいずれか一つを用いることで、AlとCuとが相互に拡散することを防げる。

【0042】

さらに、本発明では、ボンディングパッドと補助Cu配線とが接続されているため、ボンディング時の衝撃で上部Cu層にクラックが入って接続不良になっても、ボンディングパッドと内部回路との電氣的接続を確保できる。

【0043】

【発明の実施の形態】

本発明の半導体装置は、耐衝撃層として、ボンディングパッドの下層にバリアメタルを介して形成された上部Cu層と、この上部Cu層と電氣的に絶縁された下部Cu層とを設けたことを特徴とする。

【0044】

(第1実施例)

本発明の半導体装置の構成について説明する。

【0045】

図1は本発明の半導体装置の一構成例を示す平面図および断面構造図である。

【0046】

図1(b)の断面構造図に示すように、本発明の半導体装置は、アルミニウム(A1)を主成分とする金属膜を含むボンディングパッド130の下層に、アルミニウムが下層に含まれる元素と反応するのを防ぐためのバリアメタルを介して形成された、衝撃耐性向上のための上部Cu層100を有する構成である。

【0047】

上部Cu層100およびボンディングパッド130は平面寸法が略同一（誤差

の範囲内で同一であることを意味する)であり、上部Cu層100がボンディングパッド130を下方から均一に支持する。

【0048】

また、図1(b)に示すように、衝撃耐性をより向上させるために、上部Cu層100の下層に酸化膜(SiO₂膜)32を介して、上部Cu層100と電氣的に絶縁された下部Cu層200を設けている。上部Cu層100および下部Cu層200の間に低比誘電率膜よりも硬質な絶縁膜のSiO₂膜32を設けることで、ボンディング時に加わる力による沈み込みを防止している。

【0049】

本実施例では、上部Cu層100は上部第1Cu層110および上部第2Cu層120の2層を有し、この2層は、Cuを主成分とするビアプラグ140で電氣的に接続されている。このように、上部Cu層100を複数の層にすることで、ボンディングパッド130に加わる衝撃が各層に分散されるため、より衝撃耐性が向上する。

【0050】

上部第2Cu層120およびビアプラグ140のそれぞれは、第1の材料よりなる絶縁膜であるSiO₂膜42、44にそれぞれ埋設されている。上部第2Cu層120およびビアプラグ140が埋設された絶縁膜が硬質であるため、絶縁膜が上部第2Cu層120およびビアプラグ140を均一に支持する。上部第2Cu層120およびビアプラグ140はボンディング時に加わる力を最も大きく受ける部分であるため、上部第2Cu層120およびビアプラグ140を、低比誘電率膜よりも硬質な絶縁膜のSiO₂膜に埋設することが望ましい。

【0051】

また、下部Cu層200は下部第1Cu層210および下部第2Cu層220の2層を有する。この2層は、SiO₂膜22で絶縁されている。下部Cu層200を複数のCu層にすることで、上述の上部Cu層100と同様な効果がある。下部第1Cu層210のCu層パターン間には、梯子型水素化シロキサン構造を持つ低比誘電率膜であるラダーオキサイド(L-Ox (NECエレクトロニクス株式会社の商標(出願中)))膜、およびSiO₂膜からなる積層絶縁膜14

が介在している。下部第2 Cu層 220についても、同様に、L-Ox膜およびSiO₂膜からなる積層絶縁膜 24がCu層パターン間に介在している。第1の材料に比べて比誘電率が低い第2の材料を有する絶縁膜としてL-Ox膜を用いることにより、下部Cu層 200と同一層に形成されるCu配線の配線間容量が低減される。

【0052】

さらに、本発明の半導体装置は、半導体基板 10上に形成された、トランジスタ、抵抗およびキャパシタ等の半導体素子と、これらの半導体素子を接続するための回路配線とを有する内部回路を備えている。回路配線は、例えば、上部Cu層 100および下部Cu層 200のうちいずれかと同一層に形成されたCu層、半導体基板 10に形成された拡散層、ならびに不純物拡散されたポリシリコン等の導電層により形成される。ボンディングパッド 130は、上部Cu層 100を介して内部回路と接続されている。なお、半導体素子、回路配線および内部回路については、図に示すことを省略している。

【0053】

次に、上部Cu層 100および下部Cu層 200の平面パターンについて説明する。

【0054】

図1 (a)は上部第1 Cu層 110の平面パターンとして設けられたダミーパターンの一例を示す模式図であり、鎖線部分の断面構造が図1 (b)に示されている。なお、上部第2 Cu層 120の平面パターンについては上部第1 Cu層 110と同様なため、以下では、説明を省略する。

【0055】

図に示すように、上部第1 Cu層 110の平面パターンは、Cuの面積密度が均一になるように、L-Ox膜およびSiO₂膜からなる積層絶縁膜 34の方形状パターンがCu層に複数配置された構成である。上部第1 Cu層 110について、平面パターンのCu面積占有率であるCu面積率は、衝撃耐性を向上させるために、回路配線が形成される層よりも大きい。実験結果から、Cu面積率は70%以上であることが望ましい。また、Cu層のCMP (Chemical M

echanical Polishing) 処理の際のディッシングを防止するために、Cu 面積率は 95% 以下であることが望ましい。

【0056】

図 1 (c) は下部第 1 Cu 層 210 の平面パターンとして設けられたダミーパターンの一例を示す模式図であり、鎖線部分の断面構造が図 1 (b) に示されている。なお、下部第 2 Cu 層 220 の平面パターンについては下部第 1 Cu 層 210 と同様のため、以下では、説明を省略する。

【0057】

図に示すように、下部第 1 Cu 層 210 の平面パターンは、Cu の面積密度が均一になるように、十字状パターンの積層絶縁膜 14 が Cu 層に複数配置された構成である。下部第 1 Cu 層 210 の Cu 面積率は、衝撃耐性をより向上させるために 15% 以上であることが望ましく、上部 Cu 層 100 と同様の理由で 95% 以下であることが望ましい。また、下部 Cu 層 200 は上部 Cu 層 100 に比べてボンディング時に受ける衝撃力が小さいため、下部 Cu 層 200 の Cu 面積率は上部 Cu 層 100 と比べて同等以下であってもよい。

【0058】

なお、下部 Cu 層 200 の平面パターンは、上部 Cu 層 100 と電氣的に絶縁されているため、ダミーパターンの代わりに、回路配線のためのパターンであってもよい。下部 Cu 層 200 を回路配線層として利用することで、ボンディングパッド 130 の下の領域を有効に活用できる。このとき、下部 Cu 層 200 の Cu 面積率は上部 Cu 層 100 の Cu 面積率より小さくなる。また、下部第 1 Cu 層 210 および下部第 2 Cu 層 220 は、層間絶縁膜で電氣的に絶縁されているが、ビアプラグを介して電氣的に接続するようにしてもよい。

【0059】

次に、図 1 (b) に示した断面構造図を用いて、本実施例の半導体装置の製造方法について説明する。以下では、ボンディングパッド 130 の衝撃耐性向上のための部分について説明し、耐衝撃層となる各 Cu 層と同一層に形成される回路配線についての詳細な説明は省略する。

【0060】

半導体基板 10 の上に図に示さないトランジスタ、抵抗およびキャパシタ等の半導体素子を形成し、その上に CVD 法により、層間絶縁膜として SiO₂ 膜 12 を 300～500 nm 形成し、エッチング停止のための膜（以下、「エッチングストッパー膜」と称する）として Stopper-SiCN 膜 13 を 30～50 nm 形成する。

【0061】

続いて、Stopper-SiCN 膜 13 の上に、塗布法および焼成処理により L-Ox 膜を 300～500 nm 形成し、その上に SiO₂ 膜を 100～200 nm 成膜して、L-Ox 膜および SiO₂ 膜からなる積層絶縁膜 14 を形成する。その後、ホトリソグラフィ工程（以下、「ホトリソ工程」と称する）によりレジストパターンを積層絶縁膜 14 上に形成し、エッチング工程により、所定のダミーパターン、および図に示さない回路配線を形成するための配線用溝部を積層絶縁膜 14 に形成した後、レジストパターンを除去する。

【0062】

ダミーパターンおよび配線用溝部が形成された積層絶縁膜 14 上にバリアメタルを 30～50 nm、シード層を 50～200 nm 成膜し、その上に電解メッキ法で Cu 膜を 500～1000 nm 成膜する。続いて、CMP 処理により積層絶縁膜 14 の上面が露出するまで Cu 膜を研磨した後、Cu 拡散防止膜として Cap-SiCN 膜 15 を 30～50 nm 成膜する。このようにして、図 1 (c) に示した平面パターンを有する下部第 1 Cu 層 210 を形成する。

【0063】

その後、下部第 1 Cu 層 210 の上に SiO₂ 膜 22 を 300～500 nm 形成し、上記下部第 1 Cu 層 210 と同様にして、下部第 2 Cu 層 220 を形成する。

【0064】

次に、下部第 2 Cu 層 220 の上に SiO₂ 膜 32 を 300～500 nm および Stopper-SiCN 膜 33 を 30～50 nm 形成する。続いて、膜厚 300～500 nm の L-Ox 膜、および膜厚 100～200 nm の SiO₂ 膜からなる積層絶縁膜 34 を形成する。その後、ホトリソ工程によりレジストパター

ンを積層絶縁膜 34 上に形成し、エッチング工程により、所定のダミーパターン、および図に示さない回路配線を形成するための配線用溝部を積層絶縁膜 34 に形成した後、レジストパターンを除去する。

【0065】

ダミーパターンおよび配線用溝部が形成された積層絶縁膜 34 上にバリアメタルを 30～50 nm、シード層を 50～100 nm、および Cu 膜を 600～1000 nm 成膜する。続いて、CMP 処理により積層絶縁膜 34 の上面が露出するまで Cu 膜を研磨した後、Cap-SiCN 膜 35 を 30～50 nm 成膜する。このようにして、図 1 (a) に示した平面パターンを有する上部第 1 Cu 層 110 を形成する。

【0066】

次に、上部第 1 Cu 層 110 の上に SiO₂ 膜 42 を 300～500 nm、Stopper-SiCN 膜 43 を 50～70 nm、および SiO₂ 膜 44 を 300～500 nm 形成する。続いて、ホトリソ工程によりビアプラグ 140 形成のためのレジストパターンを SiO₂ 膜 44 上に形成し、Cap-SiCN 膜 35 が露出するまでエッチングしてビア部を形成した後、レジストパターンを除去する。その後、ホトリソ工程により上部第 2 Cu 層 120 形成のためのレジストパターンを SiO₂ 膜 44 上に形成し、エッチング工程により SiO₂ 膜 44 に図 1 (a) で示したパターンを形成する。そして、レジストパターン除去後に、ビア底部の Cap-SiCN 膜 35 をエッチングにより除去する。

【0067】

続いて、バリアメタルを 30～50 nm、シード層を 50～100 nm、および Cu 膜を 600～1000 nm 成膜する。そして、CMP 処理により SiO₂ 膜 44 上面が露出するまで Cu 膜を研磨した後、Cap-SiCN 膜 45 を 30～50 nm 成膜する。このようにして、図 1 (a) に示した平面パターンを有する上部第 2 Cu 層 120 を形成する。

【0068】

次に、Cap-SiCN 膜 45 の上に SiO₂ 膜 52 を 300～500 nm 形成し、ホトリソ工程により、上部第 2 Cu 層 120 上に開口部を設けるためのレ

ジストパターンをSiO₂膜52上に形成する。続いて、エッチング工程により、露出したSiO₂膜52、およびその下層のCap-SiCN膜45をエッチングして、上部第2Cu層120とボンディングパッド130とを接続するための開口部を形成する。レジストパターンを除去した後、スパッタリング法により、バリアメタルとしてTiN膜54を100～200nm、Al-Cu（0.5%）膜を800～1000nm、および反射防止膜としてTiN膜64を50～100nm成膜する。

【0069】

続いて、ホトリソ工程によりボンディングパッド130を形成するためのレジストパターンをTiN膜64上に形成し、エッチング工程によりボンディングパッド130を形成した後、レジストパターンを除去する。そして、ボンディングパッド130上のTiN64を覆うようにSiO₂膜62を100～200nm形成し、SiO₂膜62の上にポリイミド膜66を800～1000nm形成する。

【0070】

ホトリソ工程によりボンディングパッド130上のポリイミド膜66に開口部を形成し、開口部のSiO₂膜62およびTiN膜64をエッチングして、ボンディングパッド130を露出させる。

【0071】

本実施例では、外部から加えられた力を跳ね返そうとする性質である弾性が酸化膜より大きいCu層を、ボンディングパッド130下にバリアメタルを介して形成することにより、プロービングやボンディング時に針が跳ね返りやすく、下方に衝撃が伝わりにくくなる。そのため、衝撃耐性が向上し、ボンディングパッドにプロービングの針を立ててもパッドが破壊されることを防げる。

【0072】

また、ボンディングパッド130下にCu層が形成されているので、ボンディングの際、金ワイヤーとボンディングパッド130とを共晶させるための超音波がL-Ox膜等の低比誘電率膜に吸収されることなく金ワイヤーとボンディングパッド130に十分に伝わり、金ワイヤーとボンディングパッドとの密着性が強

化され、ワイヤプル強度が大きくなる。

【0073】

さらに、ボンディングパッド部の実質的なメタル膜厚がアルミとボンディングパッド下のCu層との和となるので、プロービングおよびボンディングに対する硬度が十分になり、下層のL-Ox膜付近にかかる荷重が軽減される。そのため、クラックが層間絶縁膜に発生することを防げる。

【0074】

(第2実施例)

本実施例は、内部回路に接続された補助Cu配線を設け、補助Cu配線にボンディングパッドを接続したことを特徴とする。

【0075】

図2は本実施例の半導体装置の断面構造図である。

【0076】

図2に示すように、本実施例の半導体装置は、内部回路に接続され、上部第2Cu層120と同一層に形成された補助Cu配線125を有し、ボンディングパッド130と補助Cu配線125とがビアホール150を介して電氣的に接続された構成である。

【0077】

本実施例の半導体装置の製造方法について説明する。なお、第1実施例と同様の工程については、その詳細な説明を省略する。

【0078】

上部第1Cu層110を形成するまで、第1実施例と同様に処理する。その後、図1に示したSiO₂膜44に補助Cu配線125形成のための溝部を形成し、上部第2Cu層120を形成する際、図2に示す補助Cu配線125を形成する。上部第2Cu層120上に開口部を設けるためのレジストパターンをSiO₂膜52上に形成する際、補助Cu配線125とボンディングパッド130を接続するためのビアホールパターンを形成する。

【0079】

本実施例では、上記第1実施例の効果を有するだけでなく、プロービングおよ

びボンディング時におけるボンディングパッドへの衝撃により、上部第2 Cu層120にクラックが発生し、上部第2 Cu層120とボンディングパッド130との間で電氣的な導通が十分に得られなくなっても、ボンディングパッド130はビアホール150および補助Cu配線125を介して内部回路との電氣的な導通を確保できる。

【0080】

なお、ボンディングパッド130は補助Cu配線125を介して内部回路と接続されるため、上部Cu層100は内部回路と接続していなくてもよい。

【0081】

さらに、補助Cu配線125を上部第2 Cu層120と同一層で形成したが、上部第1 Cu層110などその他の導電層で形成してもよい。

【0082】

(第3実施例)

本実施例は、第2実施例で示したボンディングパッドを複数配置した場合の一例を示すものである。本実施例の構成について、以下に説明する。

【0083】

図3はボンディングパッドを複数配置した場合の一例を示す平面図および断面構造図であり、図3(b)は、図3(a)に示す鎖線AA'部分の断面構造図である。なお、ボンディングパッド130上のTiN膜64からポリイミド膜66までの構成は、第1実施例および第2実施例と同様なため、図に示すことを省略している。

【0084】

本実施例では、図3(a)に示すように、スクライブ線600に近い側のボンディングパッドである外側パッド132と、外側パッド132よりチップ中心に近い側のボンディングパッドである内側パッド134とが互い違いに並んだ構成である。

【0085】

図3(b)に示すように、下部第1 Cu層210と同一層に、回路配線のための下部第1 Cu配線212が形成されている。同様に、下部第2 Cu層220と

同一層に、回路配線のための下部第2Cu配線222が形成されている。また、上部第2Cu層120と同一層に、回路配線のための上部第2Cu配線122が形成されている。

【0086】

外側パッド132の下には、耐衝撃層として、上部第2Cu層120、上部第1Cu層110、下部第2Cu層220および下部第1Cu層210が形成されている。外側パッド132は、補助Cu配線125およびビアプラグ140を介して、下部第1Cu配線212および下部第2Cu配線222に接続されている。

【0087】

内側パッド134の下には、耐衝撃層として、上部第2Cu層120および上部第1Cu層110が形成されている。内側パッド134は、補助Cu配線となる上部第2Cu配線122と接続されている。

【0088】

なお、内側パッド134の下に、下部第2Cu層220および下部第1Cu層210を設けるようにしてもよい。その際、隣り合う下部第2Cu配線222同士がショートしないように、下部第2Cu層220を設ける。下部第1Cu層210についても同様の構成となる。

【0089】

本実施例では、外側パッド132および内側パッド134について、第2実施例と同様に、プロービングおよびボンディング時におけるボンディングパッドへの衝撃により、ボンディングパッドにクラックが発生し、上部第2Cu層120とボンディングパッドとの間で電氣的な導通が十分に得られなくなっても、ボンディングパッドは補助Cu配線125を介して内部回路との電氣的な導通を確保できる。

【0090】

(第4実施例)

本実施例では、下部Cu層の層間絶縁膜として、SiO₂膜の代わりに、第1の材料に比べて比誘電率の低い材料を有する第3の絶縁膜としてSiOC膜を用

いたことを特徴とする。以下に、本実施例の構成について説明する。

【0091】

図4は、本実施例の半導体装置の構成を示す断面構造図である。

【0092】

図4に示すように、下部Cu層200として、下部第1Cu層410、下部第2Cu層412、下部第3Cu層414、および下部第4Cu層416の4層を設けている。各層は、図1(a)に示した上部第1Cu層110の平面パターンと同様である。上記4層のそれぞれは、Cu層パターン間に、 L-Ox 膜および SiO_2 膜からなる積層絶縁膜310、314、318、322のそれぞれが介在している。また、上記4層の各層間絶縁膜として、 SiOC 膜312、316、320が形成されている。

【0093】

また、本実施例では、上部Cu層および下部Cu層のCu面積率を略同一にしているため、各Cu層のCu面積率が略同一となり、衝撃がより均等に分散し、衝撃耐性がさらに向上する。

【0094】

また、本実施例における積層絶縁膜310、314、318、322、326は、 SiOC 膜であってもよい。

【0095】

本実施例のように、層間絶縁膜に低比誘電率膜を用いることで、異なる配線層の間の配線間容量を低減できる。

【0096】

次に、上記第1実施例～第4実施例および従来技術の構成について、ボンディング後に、ボンディングワイヤの引っ張り強度を調べるワイヤプル試験を行ったので、その試験方法と結果について説明する。

【0097】

ワイヤプル試験は、ボンディングワイヤを上引っ張り上げ、その強度が4 gf未満で、ワイヤが切断したり、ボールが外れたり、ボンディングパッドが剥れたりした場合を不良と判定した。ワイヤプル試験の不良率は、図5に示した従来

技術の構成で、層間絶縁膜 750 が SiO_2 膜である場合に約 10% あり、層間絶縁膜 750 が低比誘電率膜の SiOC 膜である場合には約 20% あった。これに対して、第 1 実施例～第 4 実施例の場合では、不良率はいずれも 0% であった。

【0098】

なお、上記第 1 実施例～第 4 実施例において、上部 Cu 層 100 および下部 Cu 層 200 のそれぞれは、上述の 2 層や 4 層の場合に限らず、2 層および 4 層以外の複数層であってもよい。ここで、上部 Cu 層 100 として、半導体基板 10 側からボンディングパッド 130 側に第 1 Cu 層、第 2 Cu 層、…、および第 n Cu 層 (n は 2 以上の自然数) が順に設けられている場合、第 n Cu 層およびビアプラグが第 1 の材料よりなる絶縁膜に埋設された構成となる。

【0099】

また、上部 Cu 層 100 および下部 Cu 層 200 のそれぞれは、単層であってもよい。単層にすれば、他の Cu 層を回路配線層として用いることができる。

【0100】

また、上部 Cu 層 100 および下部 Cu 層 200 の平面パターンがダミーパターンの場合、図 1 に示した形状に限られず、 Cu の面積密度が均一になるようなパターンであればよい。

【0101】

また、ビアプラグ 140 および上部第 2 Cu 層 120 をデュアルダマシン法により形成したが、シングルダマシン法によりビアプラグ 140 および上部第 2 Cu 層 120 を別々に形成してもよい。

【0102】

また、第 1 の材料を有する絶縁膜として SiO_2 膜を用いたが、他の絶縁膜であってもよい。上述のように、第 1 の材料を有する絶縁膜が SiO_2 膜である場合、上記第 2 の材料を有する絶縁膜を L-Ox 膜とし、上記第 3 の材料を有する絶縁膜を SiOC 膜としたが、第 2 の材料を有する絶縁膜および第 3 の材料を有する絶縁膜のそれぞれが、 L-Ox 膜、 SiOC 膜、 SiC 膜、 SiOF 膜、ポーラス SiO_2 膜、ポーラス SiOC 膜等の低比誘電率膜のうち少なくともいず

れか一つ含む膜であってもよい。

【0103】

また、エッチングストッパー膜およびCu拡散防止膜としてSiCN膜を用いたが、SiCNに限らず、SiC膜およびSiN膜のいずれの膜であってもよい。また、エッチングストッパー膜にSiON膜を用いてもよい。これらの膜同士で、被エッチング膜とのエッチング速度の比である選択比、および誘電率を比較し、パターン加工がしやすく、かつ配線間容量が小さくなるように、エッチングストッパー膜およびCu拡散防止膜を選択すればよい。

【0104】

また、上部Cu層100および下部Cu層200を設けることにより、ボンディング時の衝撃耐性が向上するため、上部第2Cu層120に介在するSiO₂膜44などの第1の材料を有する絶縁膜に代えて、SiO₂膜より軟質なL-Ox膜やSiOC膜などの低比誘電率膜を含む膜を設けるようにしてもよい。

【0105】

また、ボンディングパッド130のバリアメタルは、AlおよびCuが相互に拡散するのを防ぐものとして、TiN膜に限らず、Ta₂N膜であってもよい。

【0106】

さらに、上記Cu層およびビアプラグは、SiやAl等の他の元素を微量含有するものであってもよい。

【0107】

【発明の効果】

本発明は以上説明したように構成されているので、以下に記載する効果を奏する。

【0108】

本発明では、外部から加えられた力を跳ね返そうとする性質である弾性が酸化膜より大きいCu層を、ボンディングパッド下にバリアメタルを介して形成することにより、プロービングやボンディング時に針が跳ね返りやすく、下方に衝撃が伝わりにくくなる。そのため、衝撃耐性が向上し、ボンディングパッドにプロービングの針を立ててもパッドが破壊されることを防げる。

【0109】

また、ボンディングパッド下にCu層が形成されているので、ボンディングの際、金ワイヤーとボンディングパッドとを共晶するための超音波がL-Ox膜等の低比誘電率膜に吸収されることなく金ワイヤーとボンディングパッドに十分に伝わり、金ワイヤーとボンディングパッドとの密着性が強化され、ワイヤプル強度が大きくなる。

【0110】

さらに、ボンディングパッド部の実質的なメタル膜厚がアルミとボンディングパッド下のCu層との和となるので、プロービングおよびボンディングに対する硬度が十分になり、下層のL-Ox膜等の低比誘電率膜付近にかかる荷重が軽減される。そのため、クラックが層間絶縁膜に発生することを防げる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の半導体装置の一構成例を示す平面図および断面構造図である。

【図2】

第2実施例の半導体装置の構成を示す断面構造図である。

【図3】

第3実施例の半導体装置の構成を示す平面図および断面構造図である。

【図4】

第4実施例の半導体装置の構成を示す断面構造図である。

【図5】

従来技術による半導体装置の一構成例を示す断面構造図である。

【符号の説明】

10 半導体基板

12、22、32、42、44、52、62、328、330 SiO₂膜

13、23、33、43 Stopper-SiCN膜

14、24、34、310、314、318、322、326 積層絶縁膜

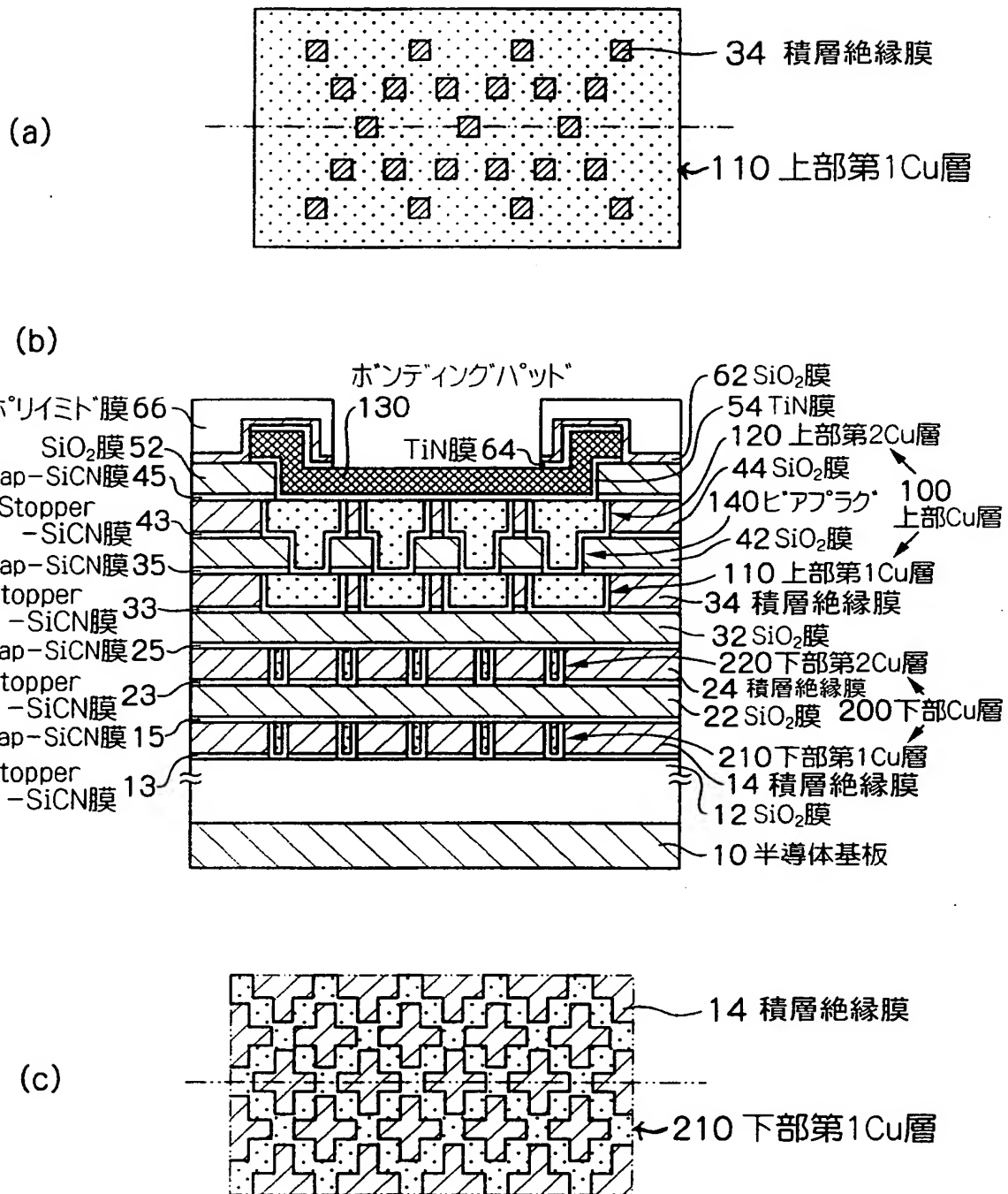
15、25、35、45 Cap-SiCN膜

100 上部Cu層

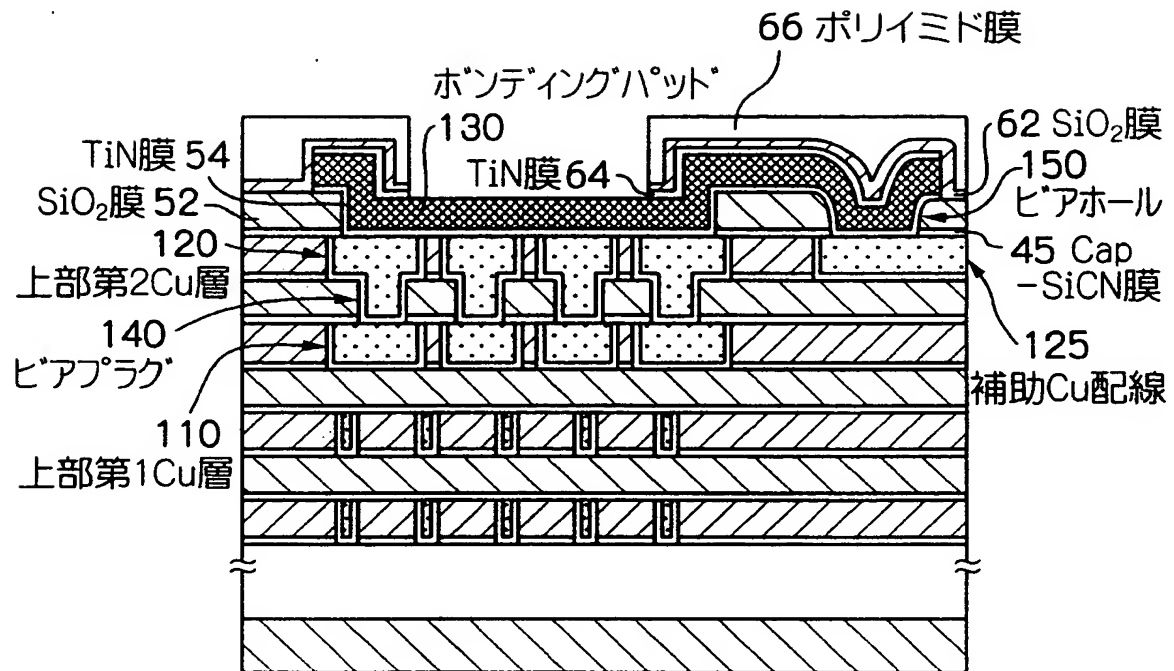
| | |
|-------------------------|--------------|
| 1 1 0 | 上部第 1 C u 層 |
| 1 2 0 | 上部第 2 C u 層 |
| 1 2 2 | 上部第 2 C u 配線 |
| 1 2 5 | 補助 C u 配線 |
| 1 3 0 | ボンディングパッド |
| 1 3 2 | 外側パッド |
| 1 3 4 | 内側パッド |
| 1 4 0 | ビアプラグ |
| 1 5 0 | ビアホール |
| 2 0 0 | 下部 C u 層 |
| 2 1 0、4 1 0 | 下部第 1 C u 層 |
| 2 1 2 | 下部第 1 C u 配線 |
| 2 2 0、4 1 2 | 下部第 2 C u 層 |
| 2 2 2 | 下部第 2 C u 配線 |
| 3 1 2、3 1 6、3 2 0、3 2 4 | S i O C 膜 |
| 4 1 4 | 下部第 3 C u 層 |
| 4 1 6 | 下部第 4 C u 層 |
| 6 0 0 | スクライプ線 |
| 7 0 0 | C u 配線 |
| 7 1 0 | C u 最上層パッド |
| 7 2 0 | バリアメタル |
| 7 3 0 | 最上層 A l 配線 |
| 7 3 5 | ボンディング部分 |
| 7 4 0 | パッシベーション絶縁膜 |
| 7 5 0 | 層間絶縁膜 |

【書類名】 図面

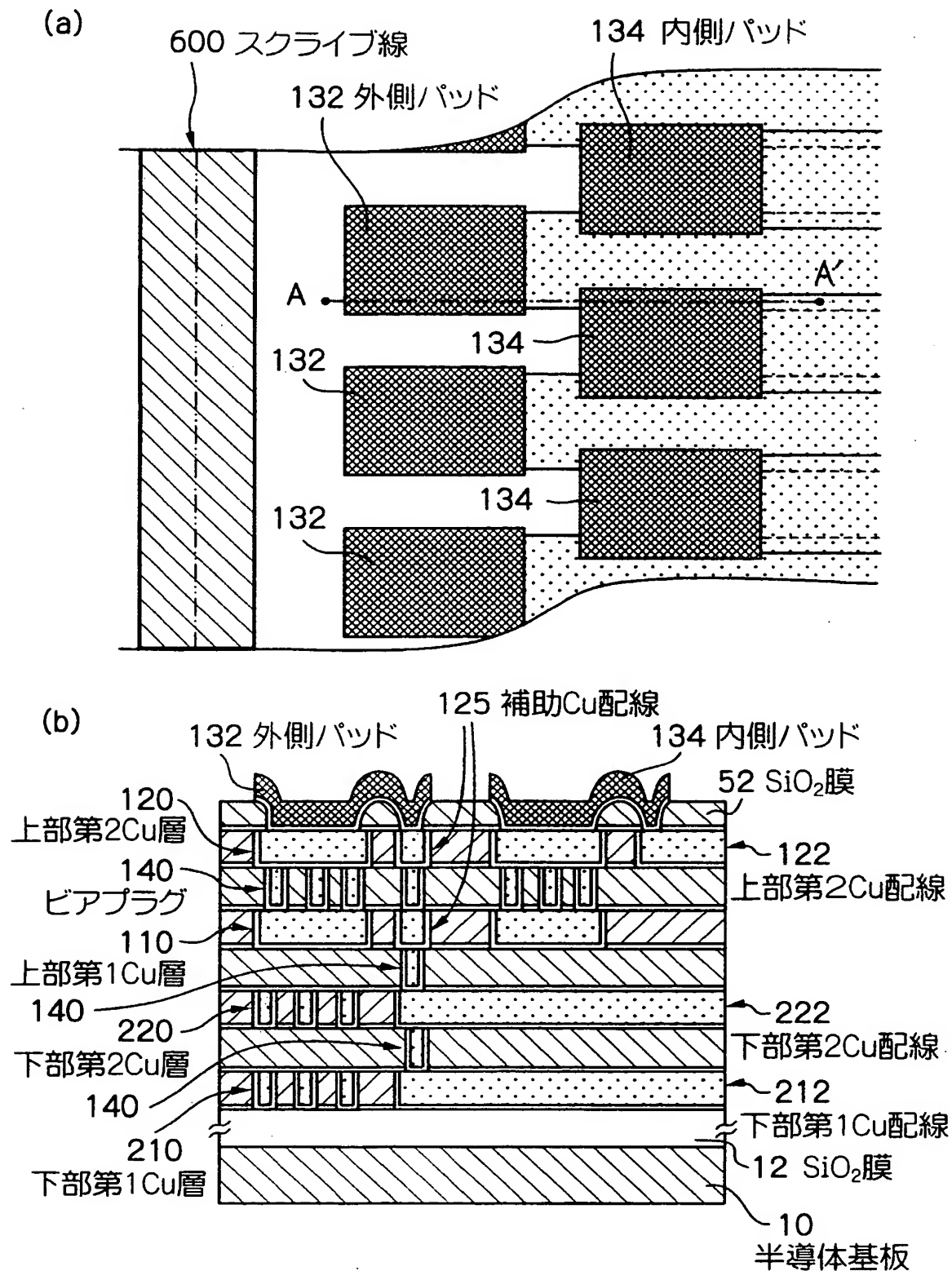
【図 1】



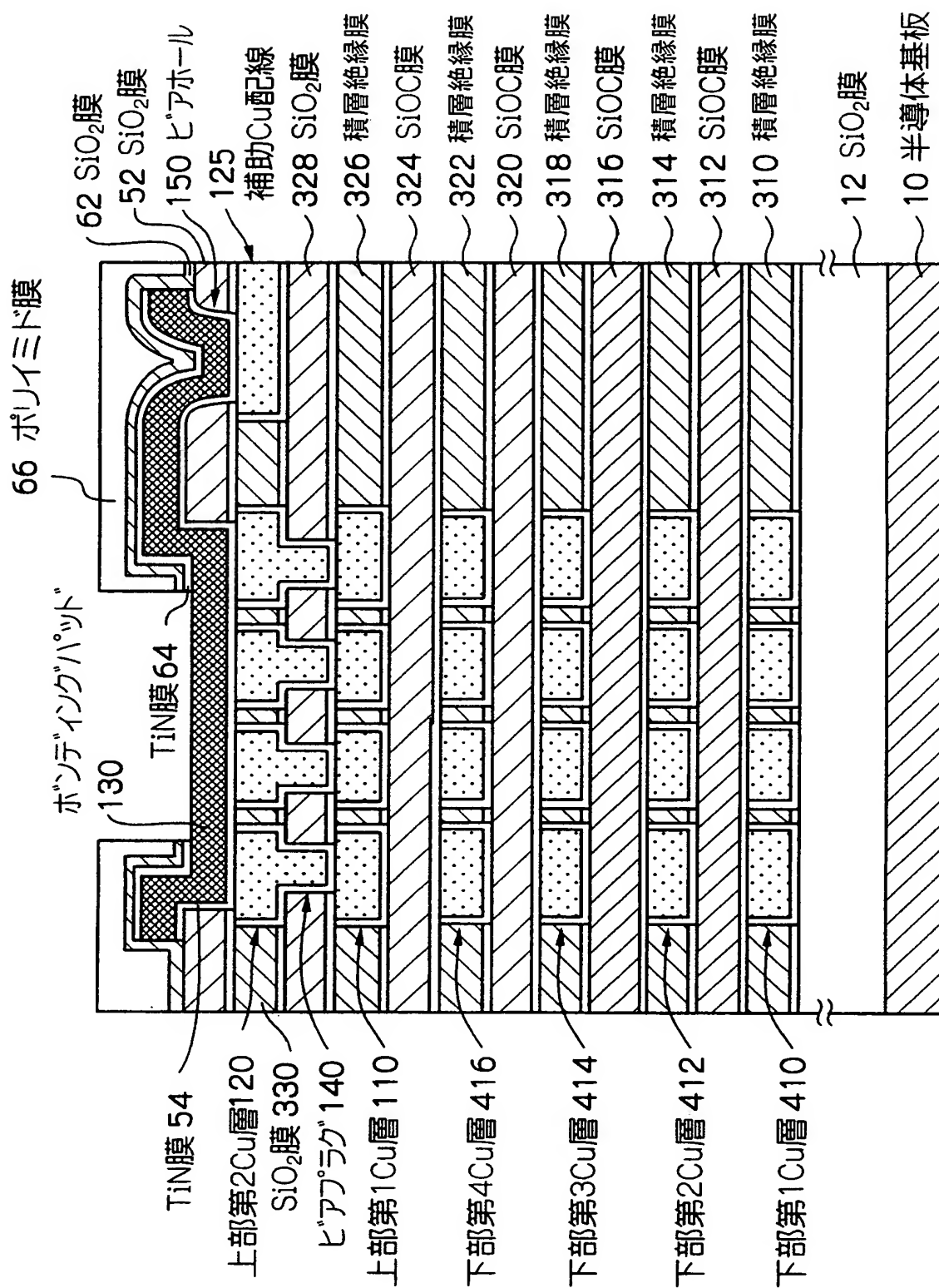
【図 2】



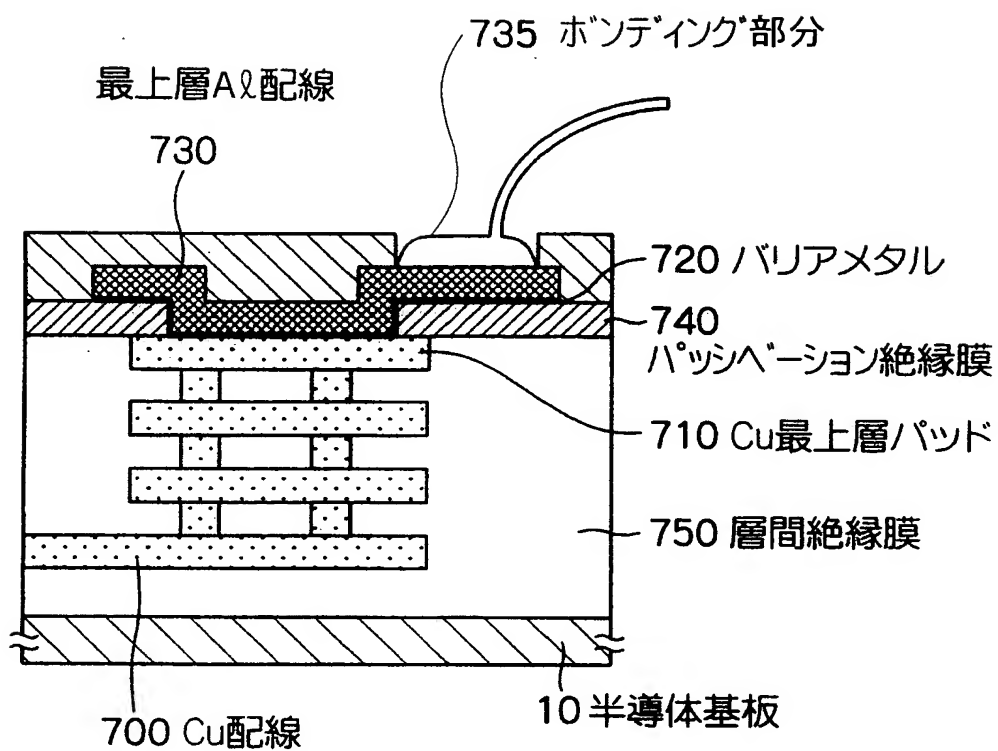
【図 3】



【図 4】



【図 5】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 ブロービングおよびボンディング時のボンディングパッドへの衝撃に対する耐性を向上させた半導体装置を提供する。

【解決手段】 半導体基板 1 0 上にボンディングパッド 1 3 0 を有する半導体装置であって、ボンディングパッド 1 3 0 の下面にバリアメタルを介して形成され、回路配線が形成される層よりも C u 面積率が大きな上部 C u 層 1 0 0 と、上部 C u 層 1 0 0 と電氣的に絶縁され、上部 C u 層 1 0 0 よりも半導体基板 1 0 側に形成された下部 C u 層 2 0 0 とを有する。

【選択図】 図 1

特願 2 0 0 3 - 0 2 1 9 5 9

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[3 0 2 0 6 2 9 3 1]

1. 変更年月日

2 0 0 2 年 1 1 月 1 日

[変更理由]

新規登録

住 所

神奈川県川崎市中原区下沼部 1 7 5 3 番地

氏 名

N E C エレクトロニクス株式会社